

FH MÜNSTER
University of Applied Sciences



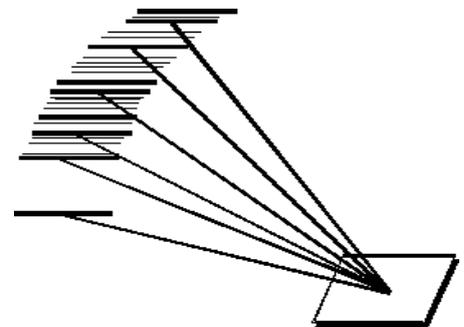
30.

Anwendertreffen

**Röntgenfluoreszenz- und
Funkenemissionsspektrometrie**

Steinfurt

25. – 26. Februar 2025



Die FH Münster veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie (DAAS) ein Treffen von Anwendern der Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie sowie verwandter Methoden der Feststoffanalyse.

Ziel des Anwendertreffens ist es, Forschung und Industrie zusammenzuführen, um den Informationsaustausch zu fördern und neue Entwicklungen anzuregen. In Kurzvorträgen wird über instrumentelle Neuentwicklungen, Lösungen aktueller Fragestellungen und insbesondere über den Einsatz dieser Methoden in Laboratorien verschiedener Industriezweige berichtet. Alle führenden Hersteller und Dienstleister auf diesem Gebiet sind vertreten.

Tagungsort:

**FH Münster
Technologiecampus Steinfurt
Gebäude S
Stegerwaldstraße 39
48565 Steinfurt**

Organisation

**Prof. Dr. M. Kreyenschmidt
M. Sc. S. Hanning**

**Dr. J. Flock
Dr. E. Pappert**

Informationen und Online-Anmeldung unter www.fh-muenster.de/ia

Kontakt:

M. Sc. Stephanie Hanning

FH Münster
Fachbereich Chemieingenieurwesen
Instrumentelle Analytik
Stegerwaldstr. 39
48565 Steinfurt
Fax 02551 962 429
E-Mail awt@fh-muenster.de



Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 9 Uhr.

Die Vorträge werden nach Abschluss der Veranstaltung für alle angemeldeten Teilnehmer zum Download bereitgestellt.

25. Februar 2025 ab 9 Uhr

Jörg Flock (AWT Team)

30-mal Anwendertreffen: vom do-it-yourself-Treffen zur etablierten Tagung

Ling Schneider (Thermo Fisher)

90 Years of ARL: Legacy to Modern XRF

Jan Stelling (Bruker)

„Das Beste aus beiden Welten: Standardlose und quantitative RFA-Analytik vollständig verbinden“

Rainer Schramm (Fluxana)

Schmelzaufschluss - Probenvorbereitung für die RFA – Ein Überblick

Dirk Töwe (HRT)

Erfolgreiche Probenvorbereitung von Ferrolegierungen

Stephanie Hanning, Michael Breuckmann (FH Münster)

Das Unsichtbare sichtbar machen

Tobias Gantenberg (Hochschule Niederrhein)

Probenahme von Bremsstäuben mit Kaskadenimpaktoren

Davide Campanello (BKA)

Röntgenanalytik in der Forensik

Markus Boner, Dirk Wissmann (Agroisolab & Spectro)

Kombination der Analyse des stabilen Isotopenverhältnisses mit der Spurenelementanalyse mittels ED-RFA zur Feststellung der Herkunft verschiedener Materialien – Beispiel Holz

Dominik Steiner (KETEK)

Silizium Drift Detektoren und Ausleseelektronik der neuesten Generation

Markus Krämer (Axo Dresden)

Fulfilling three wishes at once: Progress on the multilayer wishlist

Volker Hückelkamp (Spectro)

Kontrolle von CuNi-Legierungen im Continuous Casting mittels ED-RFA

Jana Kalbacova (Horiba)

Qualitätssicherung mittels XRF: Vom Labor bis in die Produktion

26. Februar 2025 ab 9 Uhr

Michael Haschke

Die Entwicklung der Röntgenfluoreszenz wie sie im Anwendertreffen reflektiert wurde und wie ich sie gesehen habe

Christian Hirsche (Bruker)

Mikro-RFA Methoden zur fortgeschrittenen Materialcharakterisierung

Yasemin Oguz (Hochschule Niederrhein)

Schwermetalle auf Pflanzenoberflächen

Janine Piela (Speira)

Industrieller Standard: Schichtgewichtbestimmung mit WDX und EDX – ein Methodenvergleich

Daniel Sachtler (Malvern Pananalytical)

(Noch) schnellere Analysen mit energiedispersiver RFA?

Kai Behrens, Adrian Fiege (Bruker)

„Von Counts zu Konzentrationen: Moderne Technologie als Übersetzungshilfe für die RFA“

Jürgen Schram (Hochschule Niederrhein)

Das böse Grün - Problematische Elemente in historischen Büchern

Christoph Kiesendahl (Fink & Partner)

Digitalisierung 4.0 mit einem LIMS

Hafiz Ali Raza (Universität Kassel)

Generation of activated carbon from urban biowaste and residual biomass to remove organic micropollutants from communal waste water

Frank Förste (TU Berlin)

Deep Learning für die Quantifizierung laborbasierter konfokaler Mikro-Röntgenfluoreszenz Messungen

Wilhelm Sanders (Thermo Fisher Scientific)

When Having No Memory is Beneficial - Verstehen des Memory Effekts bei der Optischen Funken Spektrometrie

Anfahrtsbeschreibung

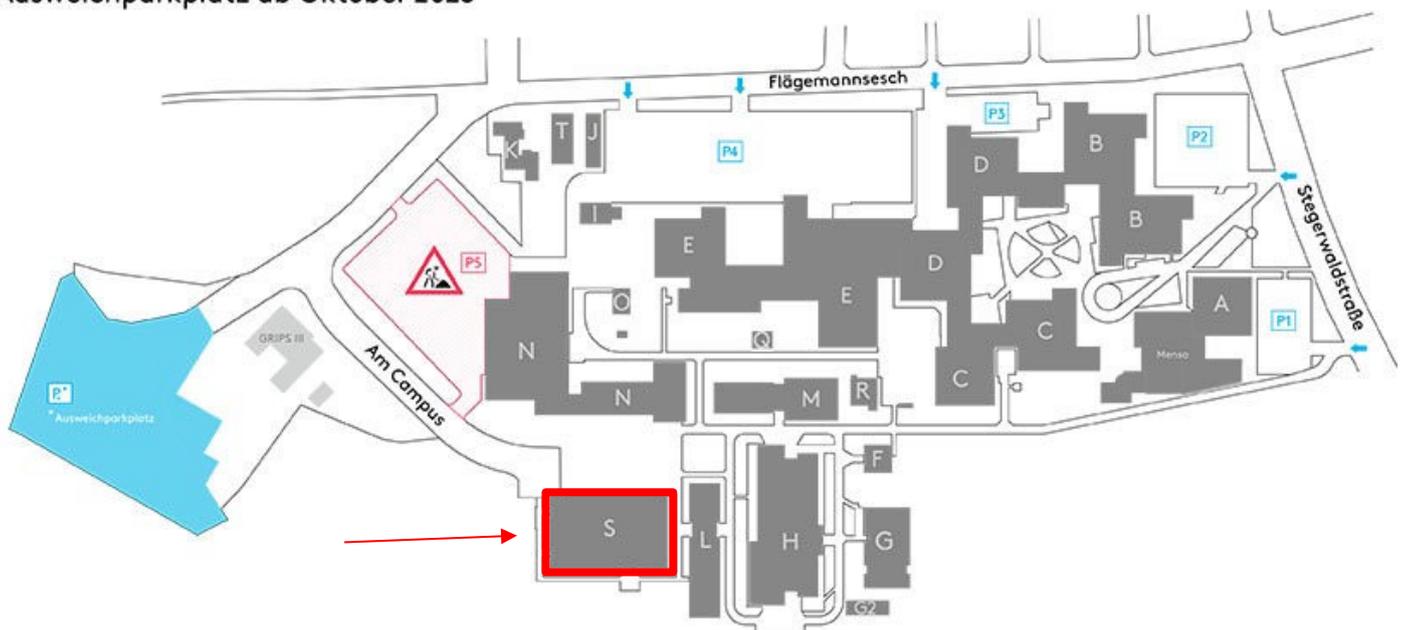
Das AWT findet am Technologie-Campus Steinfurt der FH Münster statt. Die Lage der Parkplätze (P1-P5, Ersatzparkplätze) und des Veranstaltungsgebäudes (Gebäude S) entnehmen Sie bitte dem Lageplan und der Ausschilderung vor Ort.

Sollten Sie mit dem Zug anreisen, gibt es einen Bustransfer vom Bahnhof Steinfurt zum Campus an der Stegerwaldstraße. Der Fußweg vom Bahnhof bis zum Campus beträgt ca. 7 Minuten.

Campus Steinfurt (CST)

Stegerwaldstraße 39, 48565 Steinfurt

Ausweichparkplatz ab Oktober 2023



Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.fh-muenster.de/IA unter Fort- und Weiterbildung.